

走査型透過電子顕微鏡・JEM2100F

| | |
|------------------|--|
| 製造元 | 日本電子 |
| 仕様 | 加速電圧 200 kV、EDX 付属 https://www.jeol.co.jp/products/detail/JEM-2100F.html |
| 保有部署 | 化学工学専攻 |
| 設置場所 | 桂・A2棟・1階115室 |
| 利用期間・時間、 利用料金 | 本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210311-kako |
| 注意事項等 | 測定前に使用者講習の受講が必要。有機物が多く含まれたサンプルの測定はお控えください。 |
| 連絡先 | 化学工学専攻界面制御工学研究室 准教授 渡邊 哲 075-383-2682 nabe@cheme.kyoto-u.ac.jp |
| キーワード | 組成分析、マッピング、無機粒子、金属粒子 |
| 機器コード | (KUMaCo 稼働開始後、当方で追記します) |
| 自由記入欄 | 本装置は、高輝度で高い干渉性・安定度の電子線が得られるフィールドエミッション電子銃を搭載し、ナノスケールオーダーの像観察や分析が可能です。観察モードには TEM と STEM の 2 種類があり、STEM モードでは、付属しているエネルギー分散型 X 線分析装置(EDX)を用いた EDX マッピングにより、観察領域の組成分析を行うことができます。 |

